

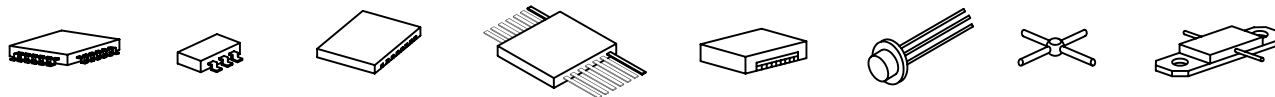
高周波テストヘッド GURFシリーズ RF Device Test Head

特徴

- ・DC～10GHzまでのデバイスの測定が可能です。
- ・日本コネクトの高信頼性プローブを使用しています。
- ・SMAコネクタ出力になっているので、測定器への接続が容易です。
- ・標準部材の採用により経済的です。
- ・カスタム仕様に対応します。一台からご発注いただけます。

対象デバイス

DBM、RF AMP、PLL、VCO、RFモジュールなど。



Specifications (example) :

周波数範囲 Frequency Range	: DC～18GHz	
RF反射損失 Return Loss (at 50Ω)	: DC～10GHz	10.0dB
RF挿入損失 Insertion Loss (at 50Ω)	: DC～10GHz	1.0dB
耐久性 Duability	: 5000回以上	

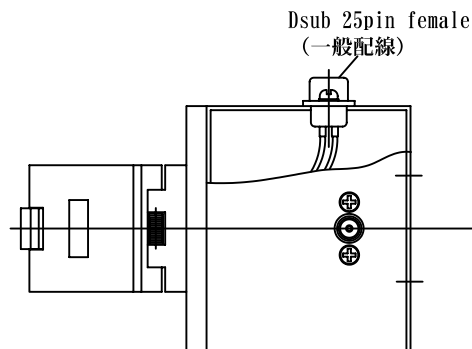
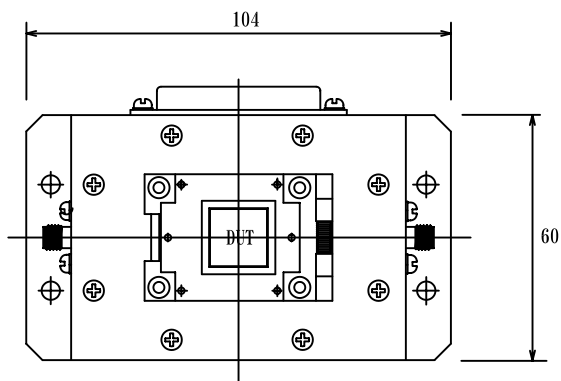
Materials (example) :

Probe Pin	
Plunger	: Beryllium copper, Ni over Gold plated
Barrel	: Brass, Ni over Gold plated
Spring	: Music wire, Ni over Gold plated
Insulator	: Teflon
Case Body	: Brass, Ni plated
Gu31 Frame	: PPS UL94V-0

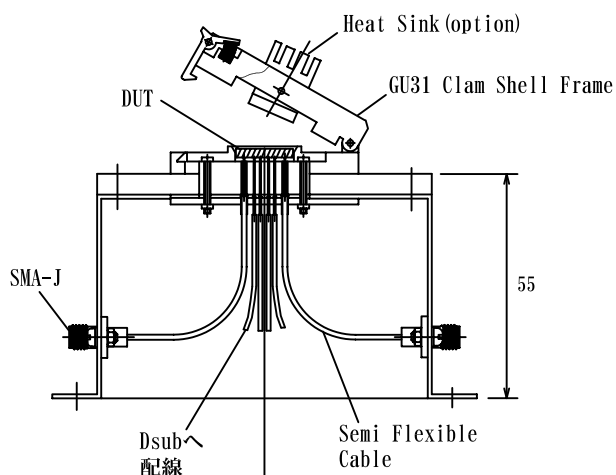
高周波テストヘッド GURFシリーズ 例

RF Device Test Head

RF2回路、及び一般配線8回路の例です

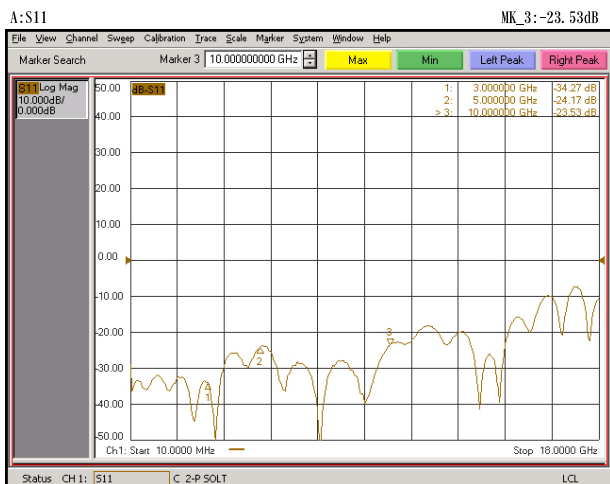


最大配線本数はデバイスのピッチ、RF回路本数、一般配線数で決まります

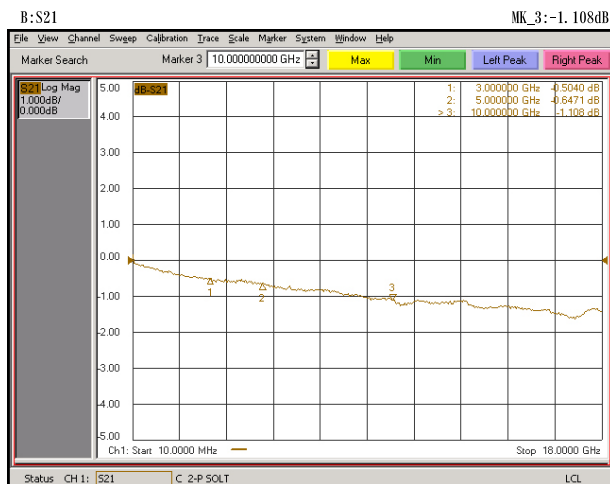


【参考データ】

反射損失 Return Loss



挿入損失 Insertion Loss



A: START:10MHz

A: STOP:18.0GHz

B: START:10MHz

B: STOP:18.0GHz